

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 595 494 A8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**
Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1)
INID code(s) 71

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (1968.09)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
05.07.2006 Patentblatt 2006/27

(43) Veröffentlichungstag:
16.11.2005 Patentblatt 2005/46

(21) Anmeldenummer: **05010491.8**

(22) Anmeldetag: **13.05.2005**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR LV MK YU

(30) Priorität: **14.05.2004 DE 102004024164**

(71) Anmelder: **Kaltenbach & Voigt GmbH**
88400 Biberach (DE)

(72) Erfinder:
• **Hack, Alexander**
88400 Biberach (DE)
• **Erdmann, Sven**
89081 Ulm (DE)
• **Heckenberger, Hans**
88433 Assmannshardt (DE)

(74) Vertreter: **Schmidt-Evers, Jürgen**
Patentanwälte Mitscherlich & Partner,
Sonnenstrasse 33
80331 München (DE)

(54) **Zahnärztliches System zum Untersuchen der optischen Eigenschaften von Zahngewebe mit optischer Untersuchungsvorrichtung und Abgleicheinrichtung**

(57) Eine Abgleicheinrichtung (50), die zur Durchführung eines Abgleichs einer Untersuchungsvorrichtung (1) mit Mitteln zum Erzeugen einer Anregungsstrahlung (A), welche auf einen zu untersuchenden Zahngewebereich zu lenken ist, Erfassungsmitteln (40) und Auswertemitteln zum Erfassen und Bewerten einer von dem bestrahlten Zahngewebereich als Antwort auf die Bestrahlung entstehenden Antwortstrahlung (F) sowie Übertragungsmitteln zum Übertragen der Anregungsstrahlung (A) sowie der Antwortstrahlung (F), welche

mindestens eine Diagnosesonde (10) zum Ausrichten der Anregungsstrahlung (A) auf den zu untersuchenden Zahngewebereich sowie zum Erfassen der Antwortstrahlung (F) umfassen, vorgesehen ist, weist ein Referenzelement (52) auf, welches zur Durchführung des Abgleichs der Untersuchungsvorrichtung (1) von dieser über die Diagnosesonde (10) zu bestrahlen ist. Erfindungsgemäße weist die Abgleicheinrichtung (50) eine Ablage (53) auf, über welche die Diagnosesonde (10) in einer definierten Position und/oder Orientierung bezüglich des Referenzelements (52) gehalten ist.

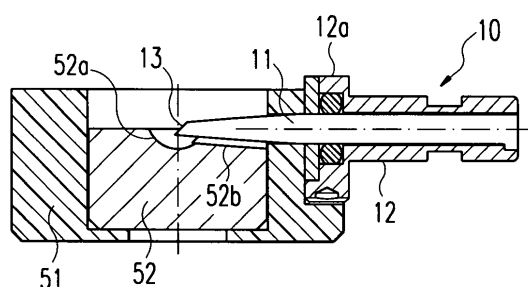


Fig. 5

EP 1 595 494 A8

专利名称(译)	用于检查牙组织的光学特性的牙科系统，包括光学检查装置和校准装置		
公开(公告)号	EP1595494A8	公开(公告)日	2006-07-05
申请号	EP2005010491	申请日	2005-05-13
[标]申请(专利权)人(译)	卡尔滕巴赫福格特有限公司		
申请(专利权)人(译)	KALTENBACH & VOIGT GMBH & CO.		
当前申请(专利权)人(译)	KALTENBACH & VOIGT GMBH		
[标]发明人	HACK ALEXANDER ERDMANN SVEN HECKENBERGER HANS		
发明人	HACK, ALEXANDER ERDMANN, SVEN HECKENBERGER, HANS		
IPC分类号	A61B5/00 A61C19/04		
CPC分类号	A61B5/0088 A61B2560/0233		
优先权	102004024164 2004-05-14 DE		
其他公开文献	EP1595494A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该系统具有光学调查装置(1)并产生辐射(A)，辐射(A)指向牙齿以进行检查。收集器和计算机评估从照射牙齿产生的返回辐射。传输装置将辐射传递到诊断探针(10)，用于将辐射对准可检查的牙齿。对准机构(50)具有参考元件(52)，其检测诊断探针的对准。对准机构具有存储区域(53)，诊断探针在该存储区域上保持在限定位置和/或与参考元件有关的取向。对准机构具有壳体(51)，其中存储有参考元件。存储区域由壳体壁中的凹槽形成，并且其形状适合于诊断探针的轮廓。

